

テクトロニクス、SEMICON Japan 2016にて、ケースレーによる最新のソリューションを展示

パワー半導体、デバイス、材料、プロセスにおける
オンウェハ特性評価、信頼性試験、不良解析を効率化し、導入コストの低減を実現

テクトロニクス(代表取締役 米山 不器)は、2016年12月14日(水)から16日(金)の3日間、東京ビックサイトにて開催される「SEMICON Japan 2016」に出展します。テクトロニクスのブース(小間番号:2228、2232)では、SiC、GaNなど最新のパワー半導体、デバイス、材料、プロセスなどのあらゆる研究/開発フェーズで、オンウェハ特性評価や信頼性試験、不良解析などの作業効率化と導入コストの低価格化を実現させるケースレーの最新のソリューションを紹介します。

<出展ブース> 2228、2232

<展示ソリューション>

- 3kV、48ピン対応パラメトリック・テスタ New S540
SiC、GaNなど、最新のパワー半導体デバイスに対応する最大3kV、48ピンの完全自動、高速ウェハレベルのパラメトリック・テスト・ソリューションを紹介します。
- オンウェハ特性/信頼性評価システム (最大30KVまで対応)
お客様の仕様に合わせて、最大30kVのオンウェハ試験に対応する特性、信頼性評価システムです。ハードウェアからデータ出力までを完全カスタマイズ可能なシステム例を展示します。
- オールインワンのパラメータ・アナライザ New 4200A-SCS
日本語などのヘルプ動画を内蔵し、マニュアルを見ずに、簡単操作でI-V、C-V、パルスI-V、トランジェント測定が可能な最新パラメータ・アナライザを展示します。
- タッチスクリーン搭載 SMU/DMM
本体上でも複雑な自動測定や、最大32台の同期測定がスマートフォン感覚で直感的に実現できるソース・メジャー・ユニットとデジタル・マルチメータを展示します。
- ハイスピード、低コストの多チャンネル測定システム
本体に最大576ch搭載可能なスイッチ・システムとハイスピードのシステム用ソース・メジャー・ユニットの組み合わせで、低抵抗から高抵抗の多点測定を低コストで実現可能な測定システムを展示します。

- 光アイソレーション型差動測定システム、USB リアルタイム・スペアナ
光アイソレーションにより 1GHz の周波数帯域と 120dB の CMRR を実現した画期的な差動測定ソリューション、およびノイズなどの RF スペクトラムをリアルタイムでモニタ可能な USB リアルタイム・スペクトラム・アナライザを紹介します。

<主な出展機器>

- S540 型パワー半導体テスト・システム
- 4200A-SCS 型パラメータ・アナライザ
- パラメトリック・カーブトレーサ
- 2461 型、DMM7510 型 タッチスクリーン式 SMU/DMM
- 2612B 型、3706A 型 ハイスピード、低コストの多チャンネル測定システム
- TIVN シリーズ IsoVu 光アイソレーション型差動プローブ

また、会期中アンケートにお答え頂いたお客様の中から先着で 30 名様に「ケースレー 高感度測定ハンドブック – 微小電流、微小電圧、および抵抗の効果的な測定方法 第 6 版」をプレゼントします。

テクトロニクスについて

米国オレゴン州ビーバートンに本社を置くテクトロニクスは、お客様の問題を解決し、詳細の理解を深め、新たな発見を可能にする、革新的で正確かつ操作性に優れたテスト／計測モニタリング・ソリューションを提供しています。テクトロニクスは70年にわたり電子計測の最前線に位置し続けています。

ウェブサイトはこちらから。 jp.tek.com

テクトロニクスの最新情報はこちらから

Twitter ([@tektronix_jp](https://twitter.com/tektronix_jp))

Facebook (<http://www.facebook.com/tektronix.jp>)

YouTube (<http://www.youtube.com/user/TektronixJapan>)

お客さまからのお問合せ先

テクトロニクス お客様コールセンター

TEL 0120-441-046 FAX 0120-046-011

URL jp.tek.com

報道関係者からのお問い合わせ先

テクトロニクス 広報室 瀬戸

電話: 03(6714)3097 Fax: 03(6714)3667

Email: atsuko.seto@tektronix.com

Tektronix、テクトロニクスは Tektronix, Inc. の登録商標です。本文に記載されているその他すべての商標名および製品名は、各社のサービスマーク、商標、登録商標です。